

**Device and method for examining an object and for affecting the object****Patent number:** DE4325724**Publication date:** 1995-02-02**Inventor:** DEBBAGE PAUL DR (DE)**Applicant:** DEBBAGE PAUL DR (DE)**Classification:****- international:** A61N5/06; G01N21/25; G01N23/08; G02B21/00; H01J37/252; A61N5/06; G01N21/25; G01N23/02; G02B21/00; H01J37/252; (IPC1-7): G01N23/00; A61B6/00; A61B10/00; A61N5/06; A61N5/10; G01N21/00; G01N21/17; G01N21/62; G02B21/00; H01J37/256**- european:** A61N5/06C2; G01N21/25C; G01N23/08; G02B21/00M4; H01J37/252**Application number:** DE19934325724 19930730**Priority number(s):** DE19934325724 19930730**Report a data error here****Abstract of DE4325724**

The invention relates to a device and method for examining an object and for affecting the object, the radiation emitted by an object being detected by a detector which produces a corresponding detector signal. This detector signal is subsequently processed such that a non-focusing apparatus for directed exposure of the partial surface of the object can be controlled as a function of the detector signal.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19 BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

12 Offenlegungsschrift

10 DE 43 25 724 A 1

21 Aktenzeichen: P 43 25 724.0

22 Anmeldetag: 30. 7. 93

43 Offenlegungstag: 2. 2. 95

51 Int. Cl. 6:

G 01 N 23/00

G 02 B 21/00

A 61 B 10/00

H 01 J 37/256

A 61 N 5/10

G 01 N 21/00

G 01 N 21/17

G 01 N 21/62

A 61 B 6/00

A 61 N 5/06

DE 43 25 724 A 1

71 Anmelder:

Debbage, Paul, Dr., 86415 Mering, DE

74 Vertreter:

Tetzner, M., Dipl.-Ing.-Univ., Pat.-Anw.; Tetzner, V.,  
Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Dr.jur., Pat.- u. Rechtsanw., 81479  
München

72 Erfinder:

gleich Anmelder

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit  
in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE 41 28 744 C1

DE 34 39 287 C2

DE 28 29 516 C2

DE 27 43 009 C2

DE 41 38 111 A1

DE 40 26 821 A1

DE 39 08 928 A1

DE 38 20 862 A1

DE 36 36 506 A1

DE 33 19 203 A1

DE 30 40 831 A1

DE 29 53 050 A1

DE 92 02 539 U1

US 50 57 102

US 50 08 907

US 49 95 068

US 48 15 448

US 44 23 736

US 37 94 840

EP 04 68 255 A2

WO 91 10 473

SU 5 53 766

SU 4 05 236

JP 63-300942 A. In: Patents Abstracts of Japan,  
P-850, March 31 1989, Vol.13, No.131;

54 Vorrichtung und Verfahren zur Untersuchung eines Objektes und zur Einwirkung auf das Objekt

57 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Untersuchung eines Objekts und zur Einwirkung auf das Objekt, wobei die von einem Objekt ausgehende Strahlung von einem Detektor empfangen wird, der ein entsprechendes Detektorsignal erzeugt. Dieses Detektorsignal wird derart weiterverarbeitet, daß eine nicht fokussierende Einrichtung zur gerichteten Bestrahlung der Teilfläche des Objekts in Abhängigkeit vom Detektorsignal angesteuert werden kann.

DE 43 25 724 A 1